

■走査電子顕微鏡

【用途】金属、セラミック、プラスチック製品等の生産工程、及び客先、市場で付いた傷や破断面を高倍率で**観察**し原因特定に活用できます。

【型式】日本電子(株) [JSM-6010PLUS/LA](#)

【仕様他】

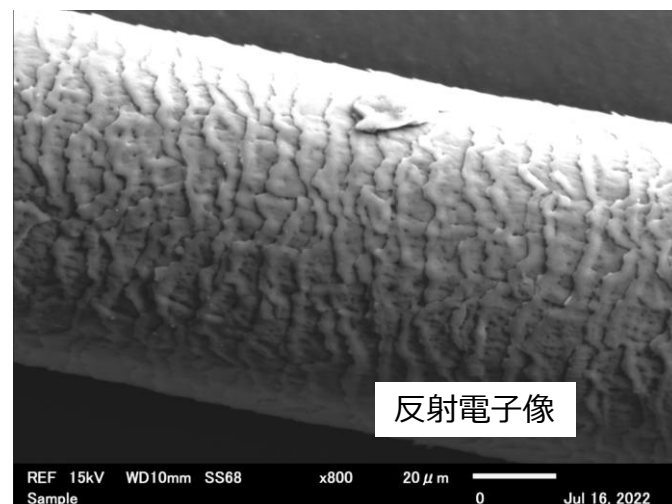
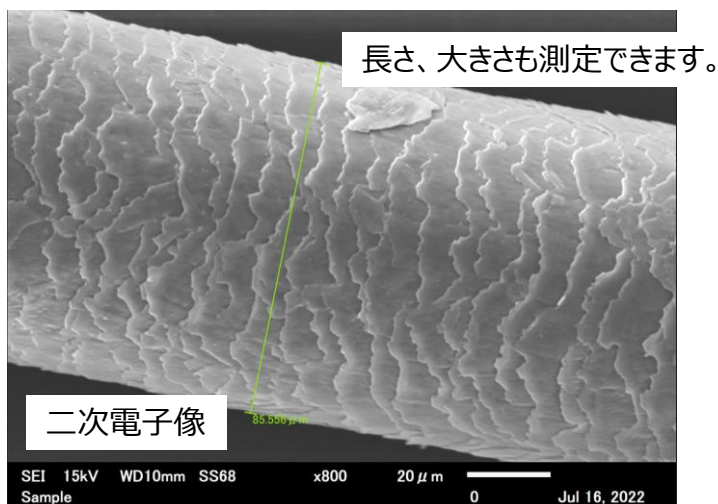
- 倍率: 5～30 万倍
- 2次電子分解能: 4.0nm
- 最大試料サイズ: $\Phi 32\text{mm}$ 、高さ48mm以下
- 加速電圧: $\sim 30\text{kV}$

【設置年】 2015(H27)年



■走査電子顕微鏡

走査電子顕微鏡 (Scanning Electron Microscope) は電子顕微鏡の一種で、電子線を絞って電子ビームとして対象に照射し、対象物から放出される二次電子、反射電子 (後方散乱電子、BSE)、透過電子、X線、カソードルミネッセンス (蛍光)、内部起電力等を検出する事で対象を観察します。



■走査電子顕微鏡+EDS

観察する試料により分析前処理が必要な場合があります。

分析前処理に必要な機器も用意しております(有料)。



イオンスパッター

導電性が無い試料
の分析を行うため
Pt-Pdコートします。



超音波洗浄器

汚れた試料を洗浄
します。